

NEWS RELEASE**国際カンファレンス「SWTest Asia 2025」に出展**

株式会社ヨコオ（本社：東京都千代田区、社長：徳間孝之）は、このたび、2025 年 11 月 20 日～22 日の 3 日間、福岡県福岡市で開催される半導体ウエハーおよびダイレベルの測定にフォーカスした国際カンファレンス「SWTest Asia 2025」に出展し、技術論文発表を 2 つのテーマについて、ポスター掲示を 1 つのテーマについて行います。

■ 展示会概要

開催期間： 2025 年 11 月 20 日(木)～11 月 22 日(土)

開催場所： ヒルトン福岡シーホーク(福岡県福岡市)

技術論文発表：

1. 11 月 21 日(金) 11:30～12:00

「A Compact OTA Measurement System with a Lens-Equipped Anechoic Chamber for Antenna-in-Package Modules」

2. 11 月 21 日(金) 14:30～15:00

「Opto-electronic probe card with single-mode fiber array for wafer-level PIC testing」

3. 11 月 20 日(木)～21 日(金)（ポスター掲示）

「Evaluation of Palladium Alloy Probe with Suppressed Sn Diffusion Reaction」

■ SWTest Asia 2025 について

SWTest(Semiconductor Wafer Test)はアメリカで 30 年以上の歴史を持つ、半導体ウエハーおよびダイレベルの測定にフォーカスした唯一の国際カンファレンスです。昨年に続き、今回「SWTest Asia 2025」が日本で開催されます。

（注） ニュースリリースに記載されている内容は報道発表日時点の情報です。その後、予告なしに変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

◇ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ヨコオ 広報部 松本
TEL: 03-3916-3179 携帯: 080-2275-3255
E-mail: h-matsumoto@jp.yokowo.com